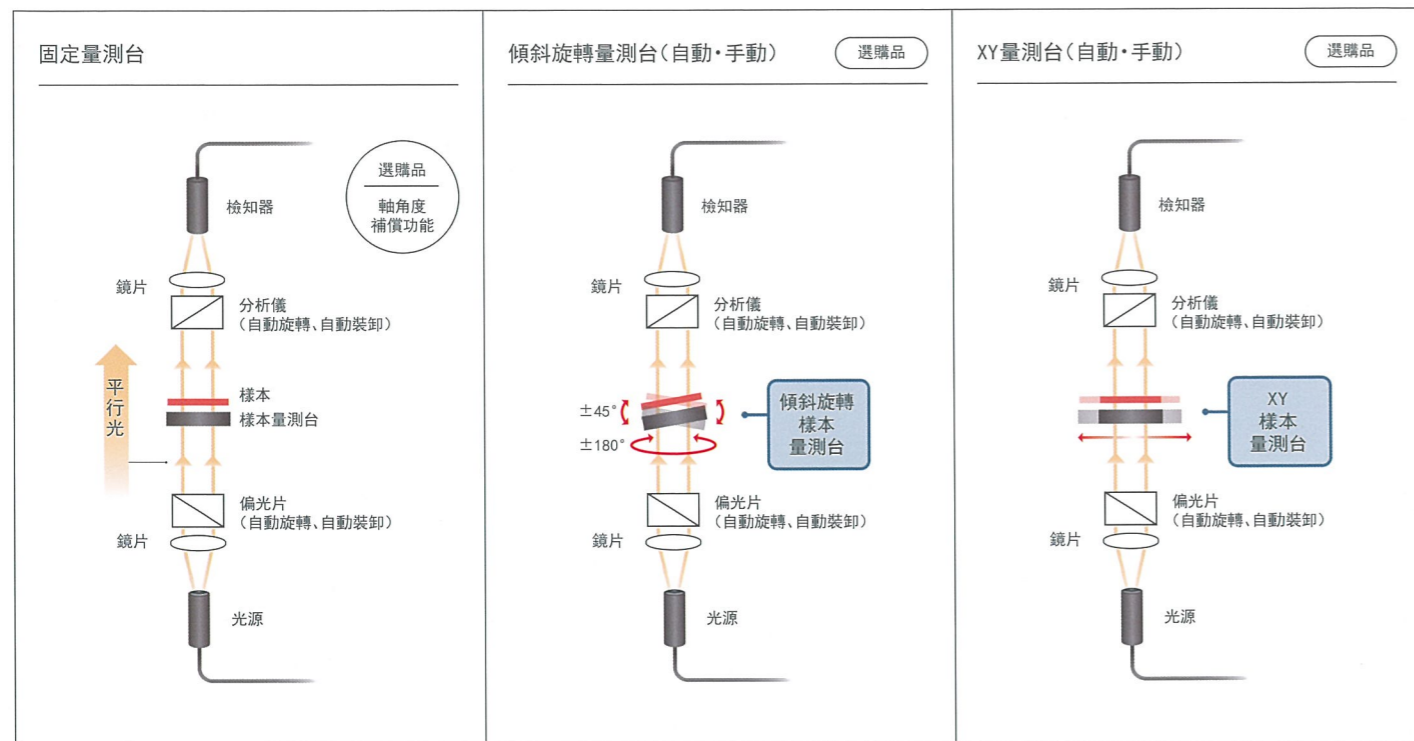


■ 規格

量測項目 (薄膜、光學材料)	Retardation (波長分散)、遲相軸、Rth*1、3維折射率*1 等	探測器	多通道分光光譜儀
量測項目 (偏光板)	吸收軸、偏光度、消光比、各種色度、各種穿透率 等	量測外徑	φ 7mm (標準規格)
量測項目 (液晶Cell)	Cell Gap、Pre-tilt角*1、Twist角、配向角等	光源	100W 鹵素燈
Retardation量測範圍	0~60,000nm	數據處理部	個人電腦、伺服器
Retardation可反覆操作	3σ ≤ 0.08nm (水晶波長板 約600nm)	量測台尺寸：標準	100mm×100mm (固定量測台)
Cell Gap量測範圍	0~600 μm (當 Δn=0.1時)	設備尺寸	W480×D520×H765mm
Cell Gap可反覆操作	3σ ≤ 0.005 μm (當Cell Gap約3 μm、Δn=0.1時)	選購品	<ul style="list-style-type: none"> · 超高Retardation量測 · 多層量測 · 軸角度補償功能 · XY量測台 (自動・手動) · 傾斜旋轉量測台 (自動・手動)
軸檢出可反覆操作	3σ ≤ 0.08° (水晶波長板 約600nm)		
量測波長範圍	400~800nm (有其他選擇)		

*1：需要傾斜旋轉量測台。(選購品)

■ 光學系列



大塚科技股份有限公司

■ 台北總公司 TEL. +886-2-2515-3066 FAX. +886-2-2515-3069
10483 台北市中山區松江路237號4樓

■ 台南事務所 TEL. +886-6-215-1970 FAX. +886-6-215-1971
700 台南市中西區永福路一段189號7F D2室



如有任何問題
請隨時與我們聯繫



NEW 兼具廣泛用途與高精度

RETS-100nx

所有
光學機能膜材
皆可對應



相位差0~60000 nm可對應
超高Retardation量測

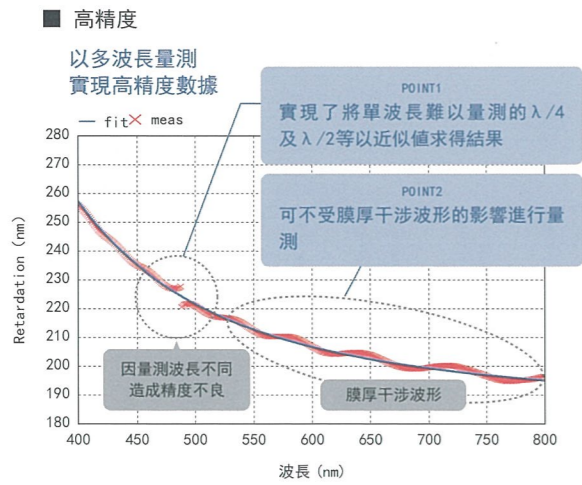
無需剝離膜材料、保持樣品原狀
多層膜量測

精度UP
軸角度補償功能

操作效率UP
簡單易懂的軟體



獨自開發的分光器可供高精度量測



可達高精度的理由

多通道分光光譜儀採用 (Mode: MCPDseries) 由光譜進行分析 **精度 UP**

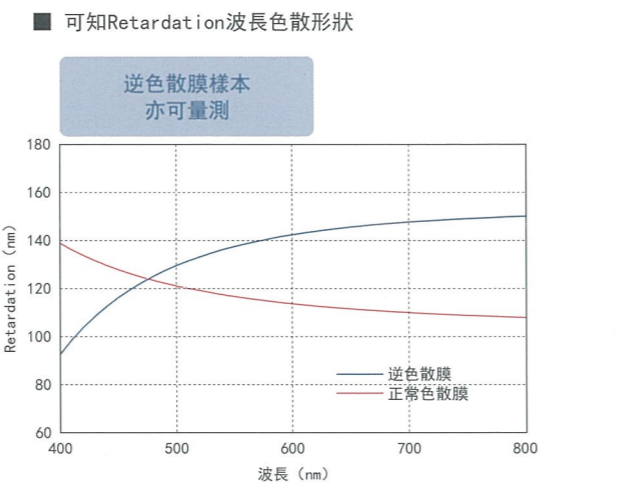
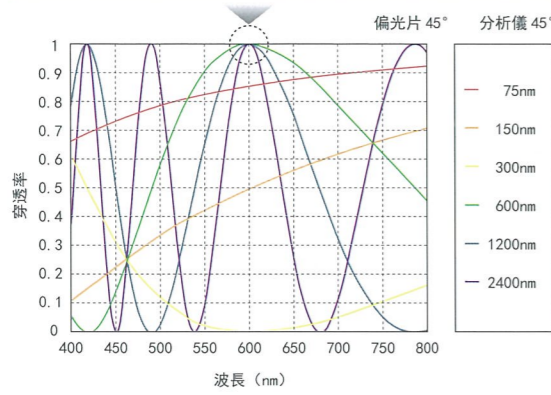
一般製品 因複數波長的切換穿透率數據僅能獲取極少量 約1~10波長以內

RETS-100NX 因可獲取更多的穿透率數據高精度的量測是可行的 約500波長

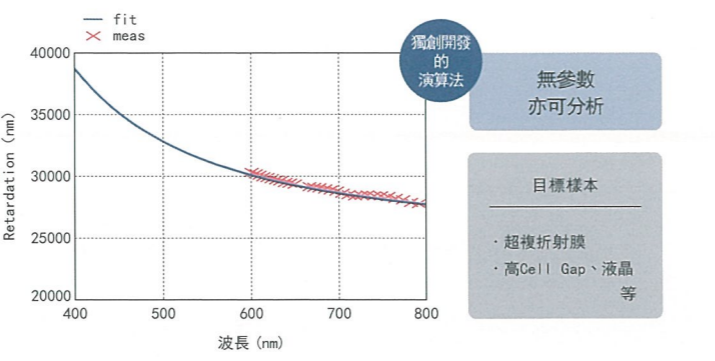
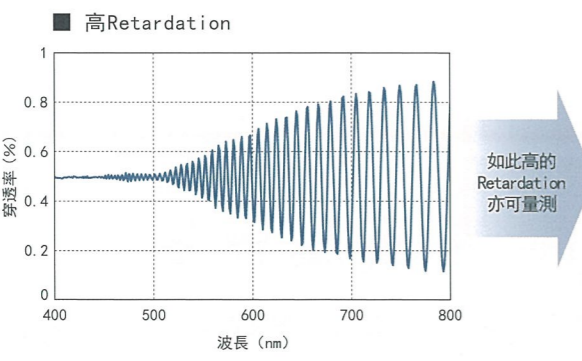
約50倍

支援各量測範圍 Retardation: 0 ~ 60000 nm

即使具有相同的強度，也可以由其他波長數據計算



新高功能 1 超高Retardation量測



超高Re. 60000奈米亦可對應

→ 以往機種 10000nm

RETS-100NX 60000nm

高速

一般製品 Ex. Monochrome scan 每次可取像一波長

RETS-100NX 一次取像多波長 約1秒



新高功能 2 多層量測 無需剝離，以非破壞方式量測各種光學機能膜材的積層狀態

RETS-100NX

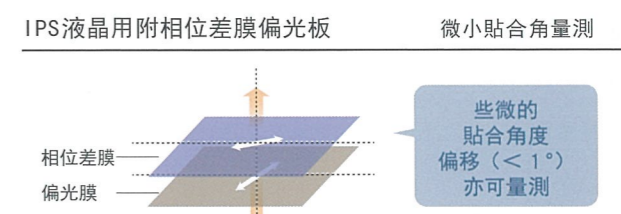
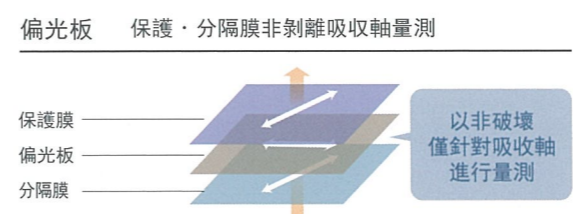
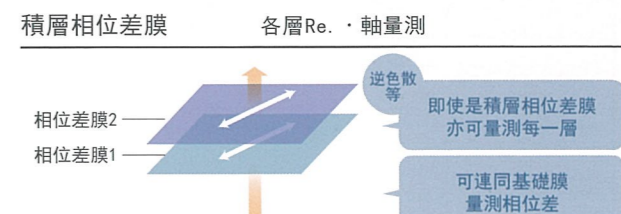
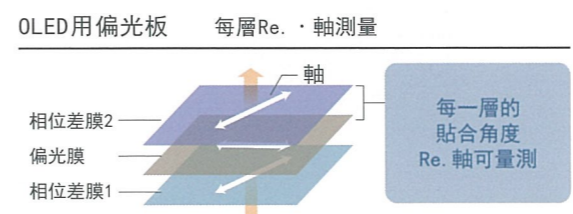
無需剝離即可實際量測

· 樣本無破壞
· 可確定貼合角度

選購品

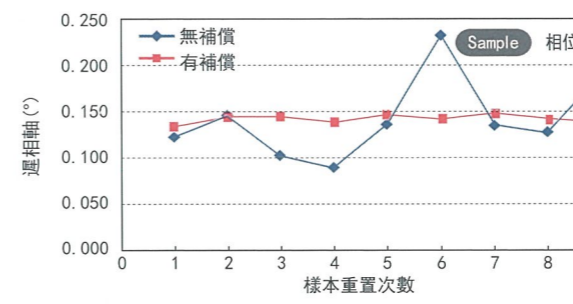
以往 需剝離多層樣本的每一層方可量測

· 樣本遭破壞
· 無法確定貼合角度



新高功能 3 軸角度補償功能 量測樣品設置有誤差也可輕鬆完成再現性量測

以樣本重置10次，以角度補償有無的結果·進行比較



無補償 重置誤差: 0.13

有補償 重置誤差: 0.013以下

精度UP 實現 1/10



新高功能 4 簡單易懂的軟體 量測時間與數據解析處理時間大幅縮短 操作效率大幅提升

在同一畫面可完成所有操作內容!

- 操作畫面
· 手放位置移動
· 選單
· 量測開始 etc
- 樣本示意圖
- 量測結果

操作畫面一目了然

順暢的操作引導

處理時間 約縮短 1/2